



Projektowanie i Testowanie Obwodów CMOS SRAM w Technologiach Nano-Skalowanych

Indeks: **712081** Producent: **Springer** Kod producenta: **biography**

Cena: 719.27 zł

Opis

CMOS SRAM Circuit Design and Parametric Test in Nano-Scaled Technologies: Process-Aware SRAM Design and Test: 40

Producent: Springer

Książka "Projektowanie obwodów CMOS SRAM i test parametryczny w technologiach nano-skalowanych: Projektowanie i testowanie SRAM w świadomości procesu" autorstwa Pavlova i Sachdeva przedstawia zaawansowane metody projektowania i testowania pamięci SRAM w technologiach nano-skalowanych. Opisuje proces świadomego projektowania SRAM, zapewniając czytelnikom wgląd w nowoczesne technologie i wyzwania z nimi związane.

Książka skupia się na zastosowaniach CMOS, RAM, SRAM oraz tranzystorów w obwodach zintegrowanych. Autorzy omawiają statyczne tranzystory indukcyjne, ułatwiając zrozumienie zagadnień związanych z elektroniką i pamięciami komputerowymi. Całość zawiera praktyczne przykłady oraz analizy techniczne.

Wydanie "Projektowanie obwodów CMOS SRAM i test parametryczny w technologiach nano-skalowanych: Projektowanie i testowanie SRAM w świadomości procesu" jest zawartością serii Frontiers in Electronic Testing. Książka ta stanowi cenny zasób wiedzy dla specjalistów z zakresu elektroniki, a także dla pasjonatów technologii nano-skalowanych oraz projektowania i testowania obwodów.

- **temat:** Circuits & components, Storage media & peripherals, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, Circuits, General, COMPUTERS / Hardware / General, COMPUTERS, Hardware, Circuits and Systems, Memory Structures, Electronic Circuits and Systems, Computer Memory Structure, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC/Informatik, EDV/Informatik, Informatik, EDV, Informatik, CMOS;DOM;RAM;SRAM;Transistor;integrated circuit;static-induction transistor, Electronics: circuits and components, Computer hardware, COMPUTERS / Hardware / General, Computers/Computer Science, Computers/Hardware - General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Circuits / General, TECHNOLOGY & ENGINEERING / Electronics / Microelectronics, Technology & Engineering/Electronics - Microelectronics, Technology & Engineering/Electronics - Semiconductors, Circuits & components, Storage media & peripherals, Computer hardware, Computerhardware, Electronics: circuits and components, Schaltkreise und Komponenten (Bauteile), HC/Informatik, EDV/Informatik, HC/Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Hardcover, Softcover / Technik/Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik
- **wiążący:** paperback
- **język:** english, english, english
- **waga przedmiotu:** 0.673 pounds

- **strony:** 210
- **słowo kluczowe tematu:** CMOS; DOM; RAM; SRAM; Transistor; integrated circuit; static-induction transistor, CMOS;DOM;RAM;SRAM;Transistor;integrated circuit;static-induction transistor, DOM; RAM; Transistor; integratedcircuit; static-inductiontransistor, Non-Fiction, SCI/TECH, Science/Math
- **marka:** Springer
- **kod podmiotu:** UK, UK, TJFC, TJFC, COM067000, COM014000, COM067000, TEC008010, TEC008070, TEC008070, TEC008090, TJFC, UKS, 1632, 1684, 1684
- **grupa docelowa:** General/trade
- **tom:** 40
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** biography
- **kolor:** White
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.75 pounds
- **wydanie:** Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2008
- **numer seryjny:** 40
- **producent:** Springer
- **tytuł serii:** Frontiers in Electronic Testing, 40
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9789048178551, 09789048178551
- **autor:** Pavlov, Andrei, Sachdev, Manoj
- **gatunek muzyczny:** Circuits & components, Storage media & peripherals, TECHNOLOGY & ENGINEERING, Electronics, Circuits, General, COMPUTERS, Hardware, General, HC, Technik, Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, HC, Informatik, EDV, Informatik, Electronics: circuits and components, Computer hardware
- **Data publikacji:** 2010-10-28T00:00:01Z
- **numer wydania:** 1
- **nazwa przedmiotu:** CMOS SRAM Circuit Design and Parametric Test in Nano-Scaled Technologies: Process-Aware SRAM Design and Test: 40
- **data premiery:** 2010-10-28T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-08-08T02:07:37.636Z

Parametry

ISBN	9789048178551
Język	angielski
Wydanie	miękka oprawa
Liczba stron	210
Wydawca	Springer